

Web of Science™InCites™Journal Citation Reports®Essential Science IndicatorsSMEndNote™

ВойтиСправкаРусский

WEB OF SCIENCE™THOMSON REUTERS™

ПоискМои инструментыИстория поискаСписок отмеченных публикаций

Результаты: 73
(из Web of Science Core Collection)

Выберите статьи, сгруппированные по имени автора: Kohn V

Вы искали: АВТОР: (Kohn V) ...Больше

Создать оповещение

Уточнение результатов

Искать в результатах...

Категории Web of Science

☐ PHYSICS APPLIED (21)

☐ OPTICS (20)

☐ INSTRUMENTS INSTRUMENTATION (17)

☐ PHYSICS CONDENSED MATTER (16)

☐ CRYSTALLOGRAPHY (15)

дополнительные параметры / значения...

Уточнить

Типы документов

☐ ARTICLE (55)

☐ PROCEEDINGS PAPER (32)

☐ BOOK CHAPTER (3)

дополнительные параметры / значения...

Уточнить

Направления исследования

Авторы

Групповые авторы

Редакторы

Названия изданий

Названия серий книг

Названия конференций

Годы публикаций

Профили организаций

Финансирующие организации

Сортировать по: Дата публикации -- с последней до самой ранней

Страница 1 из 2

☐ Выбрать всю страницу

Сохранить в EndNot...

Добавить в список отмеченных публикаций

Анализ результатов

Создание отчета по цитированию

1. Computer simulations of X-ray six-beam diffraction in a perfect silicon crystal. II

Автор: Kohn, V. G. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES Том: 73 Стр.: 30-38 Часть: 1 Опубликовано: JAN 2017

Полный текст от издателя

Просмотреть аннотацию

2. Study of a Macrodefect in a Silicon Carbide Single Crystal by Means of X-Ray Phase Contrast

Автор: Argunova, T. S.; Kohn, V. G.; Lim, J. H.; и др. CRYSTALLOGRAPHY REPORTS Том: 61 Выпуск: 6 Стр.: 914-917 Опубликовано: NOV 2016

Полный текст от издателя

Просмотреть аннотацию

3. 30-Lens interferometer for high-energy X-rays

Автор: Lyubomirskiy, Mikhail; Snigireva, Irina; Kohn, Victor; и др. JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION Том: 23 Стр.: 1104-1109 Часть: 5 Опубликовано: SEP 2016

Полный текст от издателя

Просмотреть аннотацию

4. Theory of an X-Ray Interferometer in the Form of an Array of Planar Compound Refractive Lenses

Автор: Kohn, V. G. JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION Том: 10 Выпуск: 4 Стр.: 698-704 Опубликовано: JUL 2016

Полный текст от издателя

Просмотреть аннотацию

5. Peculiarities of Section Topograms for the Multiple Diffraction of X Rays

Автор: Kohn, V. G.; Smimova, I. A. CRYSTALLOGRAPHY REPORTS Том: 61 Выпуск: 4 Стр.: 543-548 Опубликовано: JUL 2016

Полный текст от издателя

Просмотреть аннотацию

6. X-ray diffraction and X-ray standing-wave study of the lead stearate film structure

Автор: Blagov, A. E.; Dyakova, Yu. A.; Kovalchuk, M. V.; и др. CRYSTALLOGRAPHY REPORTS Том: 61 Выпуск: 3 Стр.: 362-370 Опубликовано: MAY 2016

Полный текст от издателя

Просмотреть аннотацию

7. Computer simulations of X-ray six-beam diffraction in a perfect silicon crystal. I

Автор: Kohn, V. G.; Khikhlikha, D. R. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES Том: 72 Стр.: 349-356 Часть: 3

Полный текст от издателя

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 0 (из Web of Science Core Collection)

Показатель использования

Количество цитирований: 0 (из Web of Science Core Collection)

Показатель использования

Количество цитирований: 0 (из Web of Science Core Collection)

Показатель использования

Количество цитирований: 0 (из Web of Science Core Collection)

Показатель использования

Количество цитирований: 0 (из Web of Science Core Collection)

Показатель использования

Количество цитирований: 0 (из Web of Science Core Collection)

Показатель использования

Количество цитирований: 1 (из Web of Science Core Collection)

Показатель использования

Языки	Опубликовано: MAY 2016	
	Полный текст от издателя	
	Просмотреть аннотацию	
Страны/территории		
Открытый доступ		
Для применения расширенных параметров уточнения используйте		
Анализ результатов	☐ 8. 30-lens interferometer for high energy X-rays Автор: Lyubomirskiy, M.; Snigireva, I.; Vaughan, G.; и др. Отредактировано: Shen, Q; Nelson, C Конференция: 12th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation (SRI) Местоположение: New York, NY публ.: JUL 06-10, 2015 Спонсоры: Natl Synchrotron Light Source II; Brookhaven Natl Lab PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYNCHROTRON RADIATION INSTRUMENTATION (SRI2015) Серия книг: AIP Conference Proceedings Том: 1741 Номер статьи: 040022 Опубликовано: 2016 Полный текст от издателя Просмотреть аннотацию	Количество цитирований: 0 <i>(из Web of Science Core Collection)</i> Показатель использования
	☐ 9. A study of X-ray multiple diffraction by means of section topography Автор: Kohn, V. G.; Smimova, I. A. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES Том: 71 Стр.: 519-525 Часть: 5 Опубликовано: SEP 2015 Полный текст от издателя Просмотреть аннотацию	Количество цитирований: 2 <i>(из Web of Science Core Collection)</i> Показатель использования
	☐ 10. Mechanisms of the formation of morphological features of micropipes in bulk crystals of silicon carbide Автор: Argunova, T. S.; Gutkin, M. Yu.; Kohn, V. G.; и др. PHYSICS OF THE SOLID STATE Том: 57 Выпуск: 4 Стр.: 752-759 Опубликовано: APR 2015 Полный текст от издателя Просмотреть аннотацию	Количество цитирований: 0 <i>(из Web of Science Core Collection)</i> Показатель использования
	☐ 11. X-ray multilens interferometer based on Si refractive lenses Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Lyubomirskiy, M.; и др. OPTICS EXPRESS Том: 22 Выпуск: 21 Стр.: 25842-25852 Опубликовано: OCT 20 2014 Полный текст от издателя Просмотреть аннотацию	Количество цитирований: 6 <i>(из Web of Science Core Collection)</i> Показатель использования
	☐ 12. Capsule-like voids in SiC single crystal: Phase contrast imaging and computer simulations Автор: Kohn, V. G.; Argunova, T. S.; Je, J. H. AIP ADVANCES Том: 4 Выпуск: 9 Номер статьи: 097134 Опубликовано: SEP 2014 Полный текст от издателя Просмотреть аннотацию	Количество цитирований: 0 <i>(из Web of Science Core Collection)</i> Показатель использования
	☐ 13. Propagation of an X-ray beam modified by a photonic crystal Автор: Kohn, V. G.; Snigireva, I.; Snigirev, A. JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION Том: 21 Стр.: 729-735 Часть: 4 Опубликовано: JUL 2014 Полный текст от издателя Просмотреть аннотацию	Количество цитирований: 0 <i>(из Web of Science Core Collection)</i> Показатель использования
	☐ 14. X-ray multilens interferometer based on Si refractive lenses Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Lyubomirskiy, M.; и др. Отредактировано: Morawe, C; Khounsary, AM; Goto, S Конференция: Conference on Advances in X-Ray/EUV Optics and Components IX held as part of the SPIE 2014 International Symposium on Optics + Photonics Местоположение: San Diego, CA публ.: AUG 18-20, 2014 Спонсоры: SPIE ADVANCES IN X-RAY/EUV OPTICS AND COMPONENTS IX Серия книг: Proceedings of SPIE Том: 9207 Номер статьи: 920703 Опубликовано: 2014 Полный текст от издателя	Количество цитирований: 0 <i>(из Web of Science Core Collection)</i> Показатель использования

[Просмотреть аннотацию](#)

- ☐ 15. **Computer simulation of images of photonic crystals for hard X rays in a transmission scheme. Near field**
Автор: [Kohn, V. G.](#); Tsvigun, N. V.
[CRYSTALLOGRAPHY REPORTS](#) Том: 59 Выпуск: 1 Стр.: 1-5 Опубликовано: JAN 2014
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **1**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 16. **Quantitative hard x-ray phase contrast imaging of micropipes in SiC**
Автор: [Kohn, V. G.](#); Argunova, T. S.; Je, J. H.
[AIP ADVANCES](#) Том: 3 Выпуск: 12 Номер статьи: 122109
Опубликовано: DEC 2013
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **4**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 17. **Spectrometer for hard X-ray free-electron laser based on diffraction focusing**
Автор: [Kohn, V. G.](#); Gorobtsov, O. Y.; Vartanyants, I. A.
[JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION](#) Том: 20 Стр.: 258-265 Часть: 2 Опубликовано: MAR 2013
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **1**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 18. **X-RAY STANDING WAVE IN COMPLEX CRYSTAL STRUCTURES**
Автор: Kohn, Victor
Отредактировано: Zegenhagen, J; Kazimirov, A
X-RAY STANDING WAVE TECHNIQUE: PRINCIPLES AND APPLICATIONS Серия книг: Series on Synchrotron Radiation Techniques and Applications Том: 7 Стр.: 68-82
Опубликовано: 2013
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **0**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 19. **ISOTOPIC EFFECT ON THE LATTICE CONSTANT OF GERMANIUM AND SILICON**
Автор: Kazimirov, Alexander; Zegenhagen, Joerg; Sozontov, Evgeny; и др.
Отредактировано: Zegenhagen, J; Kazimirov, A
X-RAY STANDING WAVE TECHNIQUE: PRINCIPLES AND APPLICATIONS Серия книг: Series on Synchrotron Radiation Techniques and Applications Том: 7 Стр.: 342-354
Опубликовано: 2013
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **0**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 20. **On the cause of a contrast change in the SR images of micropipes in SiC**
Автор: [Kohn, V. G.](#); Argunova, T. S.; Je, Jung Ho
[JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION-X-RAY SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES](#) Том: 6 Выпуск: 5 Стр.: 840-844 Опубликовано: SEP 2012
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **3**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 21. **Multimode X-ray tomography at the mediana Station of the Kurchatov synchrotron radiation source**
Автор: Podurets, K. M.; Pogorelyi, D. K.; Kaloyan, A. A.; и др.
[JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION-X-RAY SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES](#) Том: 6 Выпуск: 5 Стр.: 845-848 Опубликовано: SEP 2012
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **0**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 22. **Computer analysis of two-dimensional images in the Zernike phase contrast method for hard X rays**
Автор: [Kohn, V. G.](#); Orlov, M. A.
[CRYSTALLOGRAPHY REPORTS](#) Том: 57 Выпуск: 5 Стр.: 676-681 Опубликовано: SEP 2012
[Полный текст от издателя](#)
Количество цитирований: **0**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)

[Просмотреть аннотацию](#)

- ☐ 23. **Contact-free reactions between micropipes in bulk SiC growth**
Автор: Gutkin, Mikhail Yu.; Sheinerman, Alexander G.; Kohn, Victor G.; и др.
[PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE](#) Том: 209 Выпуск: 8 Стр.: 1432-1437
Опубликовано: AUG 2012
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **1**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 24. **High-resolution study of (002,113,11-1) four-beam diffraction in Si**
Автор: Kohn, V. G.; Kazimirov, A.
[ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A](#) Том: 68 Стр.: 331-336 Часть: 3
Опубликовано: MAY 2012
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **2**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 25. **Focusing femtosecond X-ray free-electron laser pulses by refractive lenses**
Автор: Kohn, V. G.
[JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION](#) Том: 19 Стр.: 84-92 Часть: 1
Опубликовано: JAN 2012
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **11**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 26. **Theoretical analysis of the possibilities of Zernike phase contrast method in hard X rays for nondestructive imaging of micropipes in a silicon carbide single crystal**
Автор: Kohn, V. G.; Orlov, M. A.
[CRYSTALLOGRAPHY REPORTS](#) Том: 56 Выпуск: 6 Стр.: 941-946
Опубликовано: NOV 2011
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **1**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 27. **Coplanar three-beam X-ray diffraction study in TeO2 single crystal using synchrotron radiation**
Автор: Blagov, A. E.; Koval'chuk, M. V.; Kohn, V. G.; и др.
[JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION-X-RAY SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES](#) Том: 5 Выпуск: 5 Стр.: 822-827
Опубликовано: OCT 2011
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **0**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 28. **High-resolution study of (222,113) three-beam diffraction in Ge**
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.
[ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A](#) Том: 67 Стр.: 409-414 Часть: 4
Опубликовано: JUL 2011
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **4**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 29. **Features in Phase-Contrast Images of Micropipes in SiC in White Synchrotron Radiation Beam**
Автор: Kohn, V. G.; Argunova, T. S.; Je, Jung Ho
[JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION-X-RAY SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES](#) Том: 5 Выпуск: 1 Стр.: 1-6
Опубликовано: FEB 2011
[Полный текст от издателя](#)
[Просмотреть аннотацию](#)
Количество цитирований: **3**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)
- ☐ 30. **X-ray Interferometers Based on Refractive Optics**
Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Kohn, V.; и др.
Отредактировано: McNulty, I.; Eyberger, C.; Lai, B
Конференция: 10th International Conference on X-ray Microscopy Местооположение: Univ Chicago, Chicago, IL публ.: AUG 15-20, 2010
Спонсоры: US Dept Energy; Argonne Natl Lab; Argonnes X-ray Sci Div
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON X-RAY MICROSCOPY Серия книг: AIP Conference Proceedings
Том: 1365 Стр.: 285-288
Опубликовано: 2011
Количество цитирований: **0**
(из Web of Science Core Collection)
Показатель использования [▼](#)

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)

- ☐ 31. **NANO AND MICRO STRUCTURES IMAGE BASED ON ASYMMETRIC BRAGG DIFFRACTION**
Автор: Kuyumchyan, A. V.; Kohn, V.; Kuyumchyan, D.; и др.
Отредактировано: Dobisz, EA; Eldada, LA
Конференция: Conference on Nanoengineering - Fabrication, Properties, Optics, and Devices VIII Местооположение: San Diego, CA публ.: AUG 23-24, 2011
Спонсоры: SPIE; Air Live; Fruhmnn GmbH NTL Manufacturer & Wholesaler
NANOENGINEERING: FABRICATION, PROPERTIES, OPTICS, AND DEVICES VIII Серия книг: Proceedings of SPIE Том: 8102 Номер статьи: 810216 Опубликовано: 2011

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования 

- ☐ 32. **Micropipe Reactions in Bulk SiC Growth**
Автор: Gutkin, M. Yu.; Argunova, T. S.; Kohn, V. G.; и др.
Отредактировано: Mukherjee, M
SILICON CARBIDE - MATERIALS, PROCESSING AND APPLICATIONS IN ELECTRONIC DEVICES Стр.: 187-206
Опубликовано: 2011

[Полный текст от издателя](#)

Количество цитирований: 1
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования 

- ☐ 33. **Far-field x-ray phase contrast imaging has no detailed information on the object**
Автор: Kohn, V. G.; Argunova, T. S.; Je, J. H.
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Том: 43
Выпуск: 44 Номер статьи: 442002 Опубликовано: NOV 10 2010

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 6
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования 

- ☐ 34. **Computer simulation of the zernike phase contrast in hard x-ray radiation using refractive lenses and zone plates**
Автор: Kohn, V. G.; Orlov, M. A.
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION-X-RAY SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES Том: 4
Выпуск: 6 Стр.: 941-946 Опубликовано: NOV 2010

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 3
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования 

- ☐ 35. **High-resolution study of dynamical diffraction phenomena accompanying the Renninger (222/113) case of three-beam diffraction in silicon**
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A Том: 66 Стр.: 451-457 Часть: 4 Опубликовано: JUL 2010

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 5
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования 

- ☐ 36. **Diffraction imaging of crystals with focused x-ray beams**
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Cai, Z. -H.
PHYSICAL REVIEW B Том: 81 Выпуск: 21 Номер статьи: 214112 Опубликовано: JUN 15 2010

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 1
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования 

- ☐ 37. **Observation of Strong Virtual Scattering under Three-Beam (220,371) X-Ray Diffraction in TeO2 Single Crystal**
Автор: Blagov, A. E.; Kovalchuk, M. V.; Kohn, V. G.; и др.
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS Том: 55 Выпуск: 1 Стр.: 10-14 Опубликовано: JAN 2010

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 4
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования 

- ☐ 38. **Wave theory of focusing monochromator of synchrotron radiation**
Автор: Kohn, V. G.; Chumakov, A. I.; Rueffer, R.
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION Том: 16 Стр.:

Количество цитирований: 12
(из Web of Science Core Collection)

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)**39. Spatial structure of a focused X-ray beam diffracted from crystals**

Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Snigirev, A.; и др.
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION Том: 16 Стр.: 666-671 Опубликовано: SEP 2009

Количество цитирований: **3**
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования ▼

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)**40. X-Ray Nanointerferometer Based on Si Refractive Bilenses**

Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Kohn, V.; и др.
PHYSICAL REVIEW LETTERS Том: 103 Выпуск: 6 Номер статьи: 064801 Опубликовано: AUG 7 2009

Количество цитирований: **27**
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования ▼

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)**41. Elliptical micropipes in SiC revealed by computer simulating phase contrast images**

Автор: Argunova, Tatiana; Kohn, Victor; Jung, Ji-Won; и др.
Конференция: 9th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging Местооположение: Linz, AUSTRIA публ.: SEP 15-19, 2008-2009
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE Том: 206 Выпуск: 8 Стр.: 1833-1837 Опубликовано: AUG 2009

Количество цитирований: **10**
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования ▼

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)**42. Semianalytical Theory of Focusing Synchrotron Radiation by an Arbitrary System of Parabolic Refracting Lenses and the Problem of Nano-Focusing**

Автор: Kohn, V. G.
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION-X-RAY SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES Том: 3 Выпуск: 3 Стр.: 358-364 Опубликовано: JUN 2009

Количество цитирований: **6**
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования ▼

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)**43. New imaging technique based on diffraction of a focused x-ray beam**

Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Cai, Z-H
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Том: 42 Выпуск: 1 Номер статьи: 012005 Опубликовано: JAN 7 2009

Количество цитирований: **4**
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования ▼

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)**44. High energy X-ray nanofocusing by silicon planar lenses**

Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Grigoriev, M.; и др.
Отредактировано: David, C; Nolting, F; Quitmann, C; и др.
Конференция: 9th International Conference on X-Ray Microscopy Местооположение: ETH, Zurich, SWITZERLAND публ.: JUL 21-25, 2008
Спонсоры: XRADIA; Euro Round Table Synchrotrons Free Electron Lasers; Ctr Imag Sci Tech Zurich; Swiss Natl Sci Fdn; Paul Scherrer Inst
9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON X-RAY MICROSCOPY Серия книг: Journal of Physics Conference Series Том: 186 Номер статьи: 012072 Опубликовано: 2009

Количество цитирований: **12**
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования ▼

[Полный текст от издателя](#)[Просмотреть аннотацию](#)**45. Analysis of a spatial structure of a focused x-ray beam diffracted from crystals**

Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V.; Snigirev, A.; и др.
Отредактировано: Khounsary, AM; Morawe, C; Goto, S
Конференция: Conference on Advances in X-Ray/EUV Optics and Components IV Местооположение: San Diego, CA публ.: AUG 03-05, 2009
Спонсоры: SPIE
ADVANCES IN X-RAY/EUV OPTICS AND COMPONENTS IV

Количество цитирований: **0**
(из Web of Science Core Collection)

Показатель использования ▼

[Полный текст от издателя](#)

[Просмотреть аннотацию](#)

- ☐ 46. **PROBLEM OF X-RAY SYNCHROTRON BEAM COLLIMATION BY ZONE PLATE**
Автор: Kuyumchyan, A.; Kohn, V.; Snigirev, A.; и др.
Отредактировано: Kawata, S; Shalaev, VM; Tsai, DP
Конференция: Plasmonics - Nanoimaging, Nanofabrication, and their Applications V Местоположение: San Diego, CA публ.: AUG 02-06, 2009
Спонсоры: SPIE
PLASMONICS: NANOIMAGING, NANOFABRICATION, AND THEIR APPLICATIONS V Серия книг: Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering Том: 7395 Номер статьи: 73952C Опубликовано: 2009

[Полный текст от издателя](#)

[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core Collection)

[Показатель использования](#) 

- ☐ 47. **Computer Simulation of Phase-Contrast Images in White Synchrotron Radiation Using Micropipes in Silicon Carbide**
Автор: Argunova, T. S.; Kohn, V. G.; Je, Jung Ho
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION-X-RAY SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES Том: 2 Выпуск: 6 Стр.: 861-865 Опубликовано: DEC 2008

[Полный текст от издателя](#)

[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 7
(из Web of Science Core Collection)

[Показатель использования](#) 

- ☐ 48. **Correlated reduction in micropipe cross sections in SiC growth**
Автор: Gutkin, M. Yu.; Sheinerman, A. G.; Smirnov, M. A.; и др.
APPLIED PHYSICS LETTERS Том: 93 Выпуск: 15 Номер статьи: 151905 Опубликовано: OCT 13 2008

[Полный текст от издателя](#)

[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 9
(из Web of Science Core Collection)

[Показатель использования](#) 

- ☐ 49. **Trajectory method in the theory of Laue diffraction of X rays in crystals: II. Effect of total reflection at bending deformation**
Автор: Kohn, V. G.
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS Том: 53 Выпуск: 2 Стр.: 177-182 Опубликовано: MAR-APR 2008

[Полный текст от издателя](#)

[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core Collection)

[Показатель использования](#) 

- ☐ 50. **Bragg diffraction of a focused x-ray beam as a new depth sensitive diagnostic tool**
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Cai, Z. -H.
Авторы книги: Goto, S
Отредактировано: Khounsary, AM; Morawe, C
Конференция: 3rd Conference on Advances in X-Ray/EUV Optics and Components Местоположение: San Diego, CA публ.: AUG 11-13, 2008
Спонсоры: SPIE
ADVANCES IN X-RAY/EUV OPTICS AND COMPONENTS III Серия книг: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Том: 7077 Номер статьи: 70770L Опубликовано: 2008

[Полный текст от издателя](#)

[Просмотреть аннотацию](#)

Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core Collection)

[Показатель использования](#) 

☐ [Выбрать всю страницу](#)



[Сохранить в EndNot...](#) 

[Добавить в список отмеченных публикаций](#)

Сортировать по: [Дата публикации -- с последней до самой ранней](#) 

Отображение: [50 на странице](#) 

◀ Страница из 2 ▶

73 записей совпали с запросом из 26 348 047, соответствующих установленным ограничениям.

